

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第4区分
【発行日】平成17年6月30日(2005.6.30)

【公開番号】特開2002-203399(P2002-203399A)
【公開日】平成14年7月19日(2002.7.19)
【出願番号】特願2001-332489(P2001-332489)
【国際特許分類第7版】

G 1 1 C 29/00

G 0 1 R 31/28

【F I】

G 1 1 C 29/00 6 5 5 Z

G 0 1 R 31/28 B

G 0 1 R 31/28 Y

【手続補正書】
【提出日】平成16年10月15日(2004.10.15)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

被験メモリの試験結果をメモリテストで解析する方法であって、
(a)被験メモリに試験処理を実施して結果データを生成するステップと、
(b)作業位置に前記結果データを前もって記憶することなく、前記結果データにマスクを適用するステップと、
(c)前記マスクの適用後に、前記結果データ中に残るエラー表示に従ってカウンタを起動するステップ
を含む、方法。

【請求項2】

前記カウンタの内容を閾値と比較し、閾値を満たしたときにエラー信号を生成するステップを更に含む、請求項1の方法。